

國立交通大學

理學院（應用科技）學程

碩士論文



CMOS 奈米元件閃爍雜訊與 RTS 之特性分析

The Characterization and Analysis of Flicker Noise and Random
Telegraph Signal for CMOS Nanodevices

研究生：鮑柏雯

指導教授：陳振芳 教授

中華民國九十九年七月

CMOS 奈米元件閃爍雜訊與 RTS 之特性分析

The Characterization and Analysis of Flicker Noise and Random

Telegraph Signal for CMOS Nanodevices

研究生：鮑柏雯

Student : Puo-Wen Pao

指導教授：陳振芳 博士

Advisor : Dr. Jenn-Fang Chen

國立交通大學

理學院(應用科技)學程



Submitted to Degree Program of (Applied Science and Technology)

College of Science

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Degree Program of (Applied Science and Technology)

July 2010

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十九年七月